

第27回電子顕微鏡解析技術フォーラム

会議録

(1) 日時：2007年8月31日～9月1日

(2) 場所：ウェルハートピア熱海

(3) テーマ：2007年夏の電子顕微鏡解析技術フォーラム

「電子回折で分かること～操作法から解釈まで～」

(4) 成果：電子線回折をテーマに企業の顕微鏡ユーザー、大学の先生、装置メーカーが集まり、チュートリアル、事例紹介、討論を行った。特にざっくばらんトークと題したディスカッションでは電子線回折と試料作製に大きくテーマを絞り、実際に世の中で使われるデバイスを解析する上で必要となる様々な事柄について活発な意見/知見の交換が行われた。

(5) 参加者：40名

(6) プログラム

チュートリアル「電子回折の基礎から応用まで」

明視野・暗視野・ウィークビーム法など 坂 公恭(名古屋大学)

いろいろな材料への応用、CBE Dなど 津田 健治(東北大学)

「材料・目的に応じた電子回折の解析事例」

材料解析における電子線回折パターンの適用事例 中村 新一(青山学院大学)

FFTフィルタリングを用いた評価事例 久留島 康輔(東レリサーチ)

電子回折を用いたSi基板の応力評価手法 橋川 直人(ルネサス)

動的ホロコーンビーム電子線回折法スピニングスターの紹介 鈴木 敏洋(トプコン)

『文部科学省先端研究施設共用イノベーション創出事業』

高性能電子顕微鏡群によるナノ・バイオサイエンス支援事業についての紹介

坂 公恭(名古屋大学)

「ざっくばらんトーク」

電子回折・試料作製方法について参加者による討論(2時間)

「トピックス：最新の技術・試料作製方法の紹介」

アルゴンプラズマを用いた新しい顕微鏡用試料前処理法 藤本 明良(堀場製作所)

新型PIPSの低加速ミリングによるダメージ層除去 水尾 有里(日鐵テクノ)

Dual-Beamを用いた3次元EBSD技術の紹介 村田 薫(日本FEI)

「解析事例の紹介」

- SEMで亜鉛めっき鋼板の断面がここまでよく見えるようになりました -

河野 佳世子(慶應義塾大学)

Twin EDSによるTEM/STEM-EDS分析精度の向上 鈴木 敏洋(トプコン)

「ざっくばらんトーク」

電子回折・試料作製方法について参加者による討論（2.5 時間）

文責 加藤直子（日本アイ・ビー・エム）